

参加無料

先端計測分析技術
～ナノ材料等の開発を支援～

第50回名古屋駅前イノベーションハブ
技術シーズ発表会

ナノテクノロジープラットフォーム
産総研 微細構造解析プラットフォーム
H30年度 第2回地域セミナー



日時

平成31年1月25日(金)

13:00～17:00

会場

愛知県産業労働センター(ウインクあいち)
名古屋駅前イノベーションハブ会議室
(名古屋市中村区名駅4-4-38)

定員

30名

事前申し込み締め切り 1/23(水)
※定員になり次第締め切らせていただきます

【主催】名古屋駅前イノベーションハブ運営協議会

【共催】中部経済産業局

【共催】文部科学省 ナノテクノロジープラットフォーム
産総研 微細構造解析プラットフォーム



産総研ANCFで検索 もしくは <https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html>

◆お問い合わせ・参加申し込み

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門 ANCF問合せ窓口

E-mail : anct-info-ml@aist.go.jp 電話番号 : 029-861-5300

※席に余裕があれば当日参加も可能です

産総研では、国内の産業力強化と新産業創出の先導や社会イノベーションへの貢献を目指して先端計測分析技術の開発を実施しています。その一環として、独自に開発した先端計測や分析機器などを公開し、企業や大学・研究機関でのナノ材料等の研究開発を支援しています。

本技術シーズ発表会では、公開装置の概要と測定事例などを紹介します。



プログラム

13:00	開会	中部センター		
13:05	概要説明	分析計測標準研究部門	副研究部門長	齋藤 直昭
13:20	「陽電子プローブマイクロアナライザー装置」			
		分析計測標準研究部門	主任研究員	O'Rourke Brian
13:45	「超伝導蛍光収量X線吸収微細構造分析装置」			
		ナノエレクトロニクス研究部門	主任研究員	志岐 成友
14:10	「超伝導蛍光X線検出器付走査型電子顕微鏡」			
		ナノエレクトロニクス研究部門	主任研究員	藤井 剛
14:35	「極端紫外光光電子分光装置」			
		ナノエレクトロニクス研究部門	招聘研究員	松林 信行
15:00	休憩			
15:10	「可視-近赤外過度吸収分光計測装置」			
		分析計測標準研究部門	主任研究員	細貝 拓也
15:35	「リアル表面プローブ顕微鏡装置」			
		分析計測標準研究部門	主任研究員	井藤 浩志
16:00	「固体NMR装置」			
		物質計測標準研究部門	主任研究員	服部 峰之
16:25	閉会	中部センター		

愛知県産業労働センター(ウインクあいち)

名古屋駅前イノベーションハブ会議室

住所: 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38

電話: 052-571-6131

電車をご利用の場合

JR・地下鉄・名鉄・近鉄)名古屋駅より

◎JR名古屋駅桜通口から

ミッドランドスクエア方面 徒歩5分

◎ユニモール地下街 5番出口 徒歩2分

相談会 16:30~17:00 (要予約)

相談をご希望の方は事前申し込みの際にご依頼ください。
詳細はANCF事務局よりご連絡させていただきます。
必ずしもご希望に添えない場合もございますが、
その場合はご容赦ください。



産総研ANCFで検索 もしくは <https://unit.aist.go.jp/rima/nanotech/index.html>

◆お問い合わせ・参加申し込み

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 分析計測標準研究部門 ANCF問合せ窓口

E-mail : anconf-info-ml@aist.go.jp

電話番号 : 029-861-5300

※席に余裕があれば当日参加も可能です